



主机: STT-700/X, 可选 13 或 26 个 slots, 模拟 IC 测试模块和功率器件测试模块可插入任意 slot, 混合使用, 支持灵活配置。一体式机柜, 最多可配置 416 路 VI 源和 256 路数字通道。
 软件: Visual C++, 支持 True Parallel 和 Index Parallel 两种并行测试模式。

模拟 IC 测试模块

板卡	电压/电流范围	通道数	精度	AWG/ Digitizer	特色
FOVI	±50V/300mA/1A	8	量程的 0.05%, 最小可达 0.5mv	100K/500K	分四组浮地
FPVI120	±100V/±20A	2/4	量程的 0.05%, 最小可达 0.5mv	100K/500K	全浮地, 大电流至 20A
FVI1000	±1000V/10mA	2	量程的 0.1%	100K/500K	全浮地, 高压至 1000V
FVI16	±40V/100mA	16	量程的 0.05%, 最小可达 0.5mv	100K/500K	分 4 组浮地, 多通道
FQVI	±20V/(1.5A-3A)	4	量程的 0.05%, 最小可达 0.8mv	100K/500K	全浮地, 恒流输出至 3A
QTMU	±7.5V, ±52V,	4	<3ns		浮地, 4 路 TMU
PAM	1nA	1	最小可测试 10pA 电流		pA 级电流测试
DI032	-2/+7.5V 20Mhz, 8M memory	16IO 16 OUT	最小脉冲宽度 10ns		低成本数字方案

注: VI 模块都具备电压电流实时在板精度自检功能(专利技术)。VI 模块都采用浮地结构设计。

分立器件测试模块

板卡	具体指标	精度	Digitizer	特色
DDC1230/E	3 通道 (D/G/S), ± 1400V/30A/100A	导通电阻<0.1m0hm 漏电流<3nA	500Khz	一个模块测试 一个单 MOS/IGBT
DDC2K200	3 通道 (D/G/S), ±2000V/200A	导通电阻<0.1m0hm 漏电流<3nA	500Khz	一个模块测试 一个单 MOS/IGBT
UIL3K400	3 通道 (D/G/S), ±3000V/400A	0.5A/3uS	2Mhz	0.1mH - 160mH 可调电感
DVSD120	±120V/50A/200mS (max)	2mV	500Khz	热阻测试 (最大功率 2400W)
SW12400	3 通道 (D/G/S), ±1200V/400A	Vgs ±2%/Ids ±4% Vds ±1.5%	4G	内嵌示波器
QG12100	3 通道 (D/G/S), ±1200V/100A	0.02nC	2Mhz	外接单独使用
Dynamic Rdson (GaN Mosfet)	3 通道 (D/G/S), ±650V/5uS	<1uS	2Mhz	分 soft switch 和 hard switch 两种模式
LCR module	1 通道, 2Mhz	0.1m0hm /0.01pF /0.1uH		偏置电压最高可至 1400V

注: 分立器件测试模块化设计 (专利技术)。直流外加测试盒可扩展至 4000V/400A。

数字测试模块

	具体指标	通道数	特色
DPU32	50Mhz/100Mhz vector rate (DDR) 64M vector memory depth per channel -1.5v to 6.5v, 32 timing sets change on the fly	32	PMU Per-pin / Per-pin timing 64 Timing Sets 时间测量最高达 200Mhz (max)

注: 所有模块可插入同一个机型 (STT-700/X), 使用同一个软件, 就可以测试从模拟/混合信号到功率器件的所有产品。选择我们必定会助你降本增效, 在激烈的市场竞争中立于不败之地!

备注: 上述指标可能在不通知客户的情况下更改